

Centro Brasileiro Argentino de Nanotecnologia
“Escuela de Microscopía de Barrido por Sondas”

Data: 14 a 18 de setembro de 2009

Local: Centro de Microscopías Avanzadas, UBA, Buenos Aires
Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas, La Plata

Coordenação: Profa. María Elena Vela

Profesores:

- R.C.Salvarezza
- Lia Pietrasanta
- Martín Sirena
- Carolina Vericat
- Patricia Paredes Olivera
- Hugo Ascolani
- Andrea Bragas
- María Elena Vela
- Gilberto Weissmuller
- Camila Rezende (a confirmar)

Temas:

- Fundamentos del funcionamiento del microscopio de efecto túnel y de fuerza atómica.
- Microscopio de efecto túnel (STM): principios teóricos básicos.
- Microscopio de fuerzas atómicas.
- Definición de superficie desde el punto de vista fisicoquímico.
- Aspectos prácticos de la microscopía STM: calibración en el orden de las micras y en escalas de resolución atómica.

Inscrição: as inscrições de participantes brasileiros somente serão aceitas através do email cban@mct.gov.br. Os candidatos deverão fornecer seus dados pessoais e profissionais, CV e uma justificativa com no máximo 10 linhas explicando seu trabalho científico, bem como os motivos por que deseja participar do curso. Cada inscrição deverá vir acompanhada de uma carta de anuência assinada pelo seu orientador ou chefe. Solicitamos que toda a documentação seja encaminhada em um único arquivo “.PDF”, nomeado de acordo com o último sobrenome do interessado (e.g. Interessado: Adolfo Lutz, arquivo: lutz.pdf)

Apoio financeiro: serão oferecidos apoio financeiro para transporte e alojamento aos estudantes selecionados.

Vagas: 10 estudantes brasileiros

Requisitos: Terão prioridade os candidatos que sejam doutorandos ou que tenham concluído o doutorado nos últimos 5 anos em Física, Química, Farmácia, Biologia ou Engenharias.

Data limite de inscrição: 02 de setembro de 2009. Comunicação de aceite dos candidatos: 04 de setembro de 2009.